

第73回 応用物理学会春季学術講演会にて ランチオンセミナーを開催します!!

コラボレーション
セミナー

- 2026年3月15 (日)
- 11:50~12:30
- W2-401 (西2号館)

演題

XRFとXPSを組み合わせた先端材料の評価

スピーカー

アルバック・ファイ株式会社 橋本 真希
株式会社堀場テクノサービス 泉 悠樹



フルオート多機能走査型X線光電子分光分析装置
XPS

PHI GENESIS



微小部 X 線分析装置
micro-XRF

XGT-9000 Pro/Expert

材料やデバイスの高機能化により層構造は複雑化し、異常の原因を単一手法だけで捉えることが難しくなっています。そこで、元素分布を捉える分析と、化学結合状態や深さ方向の変化を解析する手法を組み合わせ、相補的に評価するマルチモーダル解析が重要になります。

本セミナーでは、次世代自動車用として注目される固体高分子形燃料電池 (PEFC) を対象に、 μ -XRF と XPS を組み合わせた燃料電池用電極膜 (CCM) の解析事例を紹介し、さらに、ハードディスクドライブ材料に対しても、XRF や RF-GD-OES と XPS を組み合わせた適用例を示し、複雑な材料・層構造の評価における有効性を解説します。

アルバック・ファイ株式会社、株式会社堀場テクノサービス、株式会社堀場製作所はお客様の氏名、会社名、メールアドレス、その他、本学会に関して入力いただいた項目及び名刺交換等により取得した項目を共同利用いたします。アルバック・ファイ株式会社、株式会社堀場テクノサービス、株式会社堀場製作所は、それぞれのプライバシーポリシーの範囲内でそれぞれの製品・サービスに関する情報をお客様に提供させていただく場合に、上記を利用いたします。

アルバック・ファイ株式会社

〒253-8522 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500



株式会社堀場テクノサービス

〒601-8305 京都市南区吉祥院宮の東 2

